



中華民國專利證書

發明第 I 408338 號

發明名稱：干涉量測裝置及其量測方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：蔡建中、鄭東祐、王譽達、林晏聖、許光裕、黃升龍

專利權期間：自 2013 年 9 月 11 日至 2029 年 8 月 10 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長 王美花

中華民國

102



年 9 月 11 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。